ОСОБЕННОСТИ РЕЛАКСАЦИИ ЗЕРЕННОЙ И ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ

НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО СПЛАВА V-Cr-ZrO2

<u>В.Л. Радишевский</u>¹, И.В. Смирнов^{1, 2}, К.В. Гриняев^{1, 2}

Научный руководитель: доцент, д.ф.-м.н. И.А. Дитенберг

¹Национальный исследовательский Томский государственный университет,

Россия, г. Томск, пр. Ленина, 36, 634050

² Институт физики прочности и материаловедения СО РАН

Россия, г. Томск, пр. Академический, 2/4, 634055

E-mail: rvl@myttk.ru

FEATURES RELAXATION GRAIN AND DEFECT STRUCTURE OF NANOSTRUCTURED ALLOY V-Cr-ZrO₂ ALLOY

V.L. Radishevskiy¹, I.V. Smirnov^{1, 2}, K.V. Grinyaev^{1, 2}

Scientific Supervisor: docent, Dr. I.A. Ditenberg

¹National Research Tomsk State University, Russia, Tomsk, Lenina pr., 36, 634050

² Institute of Strength Physics and Materials Science SB RAS, Russia, Tomsk, Akademicheskiy pr., 2/4, 634055 E-mail: <u>rvl@myttk.ru</u>

Abstract. The study of parameters of the defect structure near the recrystallization temperature of the dispersion-strengthened alloy $V-Cr-ZrO_2$ after deformation by torsion under pressure is presented.

Введение. Формируемые в металлических материалах методами больших пластических деформаций (БПД) субмикрокристаллические и наноструктурные состояния характеризуются высокой плотностью дефектов кристаллического строения, оказывающих влияние на комплекс физикомеханических свойств [1]. Изучение стабильности указанных структурных состояний в условиях деформационного и/или термического воздействия по-прежнему остается актуальной задачей.

Целью настоящей работы является исследование особенностей зеренной и дефектной структуры наноструктурированного дисперсно-упрочненного ванадиевого сплава после отжигов вблизи температуры рекристаллизации.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на дисперсно-упрочненном сплаве V–8,75%Cr–1,17%Zr–0,14%W–0,01%C–0,02%O–0,01%N (вес. %) после БПД кручением на наковальнях Бриджмена (N = 1, P = 7 ГПа). После деформации выполнены часовые отжиги в вакуумной печи типа СШВЛ при температурах 700 и 800 °C. Структурные исследования осуществлены с использованием просвечивающей электронной микроскопии на приборе Philips CM30 (300 кВ). Тонкие фольги подготовлены по методике [2] в сечениях, нормальных плоскости наковален (ПН). Аттестация дефектной структуры проведена с использованием методики темнопольного анализа дискретных и непрерывных разориентировок [3].

Результаты. Структурная аттестация изучаемого сплава после деформации кручением под давлением подробно проведена в работе [2]. На рисунке 1 а представлено светлопольное изображение микроструктуры. Показано, что субмикрокристаллическое состояние характеризуется сильной анизотропией зеренной структуры: размеры зерен в направлениях параллельных ПН находятся в

ХІV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК»

интервале 70-700 нм, в то время как в направлении оси кручения (ОК) их размеры достигают 50-200 нм.

Проведенный в настоящей работе отжиг при T = 700 °C не оказал какого-либо влияния на зеренную и дефектную структуру изучаемого материала, при этом сохраняется аналогичное представленному на рисунке 1 а анизотропное субмикрокристаллическое состояние. В тоже время после повышения температуры отжига до 800 °C (рис. 1 б) на фоне анизотропной микроструктуры появляются почти равноосные зерна размерами от 50 до 500 нм.



Рис. 1. Микроструктура сплава V-Cr-ZrO₂ после большой пластической деформации кручением на наковальнях Бриджмена (a) [2] и отжига при T = 800 °C (б).

На рисунке 2 представлены гистограммы распределения зерен по размерам изучаемого сплава после деформации (рис. 2 а, б) и последующего отжига при T = 800 °C (рис. 2 в, г). Как видно (рис. 2), после отжига при 800 °C размеры зерен и характер их распределения в направлениях параллельных и перпендикулярных ПН сопоставимы.



Рис. 2. Гистограммы распределения зерен по размерам сплава V–Cr–ZrO₂ после деформации (а, б) и отжига при температуре 800 °C (в, г). Размеры d_∥ вдоль ПН (а, в), размеры d_⊥ вдоль ОК (б, г).

Дефектная структура субмикрокристаллического состояния после деформации характеризуется кривизной кристаллической решетки (χ_{ij}) от 10 до 40 град/мкм [2], соответствующие оценки величин локальных внутренних напряжений составляют $\sigma_{nok} \approx E/75 - E/45$.

На рисунке 3 а представлен пример темнопольного анализа особенностей тонкой дефектной структуры после отжига при 800 °C. Установлено, что при наклоне гониометра на угол $\Delta \phi \approx 1,5^{\circ}$, контур экстинкции перемещается на расстояние $\Delta r \approx 180$ нм. В соответствие с [3], компонента кривизны

Россия, Томск, 25-28 апреля 2017 г.

292

ХІV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК»

кристаллической решетки χ_{21} может быть определена по формуле $\chi_{21} \approx \Delta \phi \cdot \sin(\beta)/(\Delta r)$ (рис. 3 б). С учетом угла между вектором действующего отражения g типа <110> и направлением проекции оси наклона гониометра (ПОН) $\beta = 87,5^{\circ}$, компонента кривизны кристаллической решетки χ_{21} достигает ≈ 8 град/мкм. В случае если кривизна обусловлена только изгибом фольги, ширина контура $L_{\text{теор}} \approx \gamma_0/\chi_{21} \approx 60$ нм, где $\gamma_0 \approx 0,5^{\circ}$ – угловой размер дифракционного максимума в бездефектном кристалле. Однако экспериментальное значение $L_{\text{экс}} \approx 100$ нм. Таким образом, почти 1.5-кратное уширение контура экстинкции свидетельствует о наличии структурной кривизны кристаллической решетки, а не связано с изгибом или короблением тонкой фольги.

Согласно [3], по формуле $\sigma_{no\kappa} \approx \chi_{ij} \cdot E \cdot \Delta h/2$ (Е – модуль Юнга, Δh – характерные размеры зоны высокой кривизны кристалла) из экспериментальных данных о χ_{ij} и Δh можно оценить величину локальных внутренних напряжений. Учитывая, что $\chi_{ij} \approx 8$ град/мкм, а $\Delta h \approx 0,18$ мкм, максимальные значения σ_{nok} не превышают E/80. Таким образом, представленный результат свидетельствует о начале интенсивных процессов релаксации дефектной структуры при T = 800 °C.



Рис. 3. Пример анализа непрерывных разориентировок изучаемого сплава после отжига при T=800°С (а); схема структурного состояния с кривизной кристаллической решетки (б) [3].

Выводы. Установлено, что в наноструктурированном дисперсно-упрочненном сплаве V–Cr–ZrO₂ при температуре 800 °C активизируются процессы релаксации, которые сопровождаются ростом зерен, существенным снижении значений кривизны кристаллической решетки и величин локальных внутренних напряжений.

Исследования проведены с использованием оборудования Томского регионального центра коллективного пользования НИ ТГУ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Валиев Р.З, Александров И.В. Объемные наноструктурные металлические системы М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. 398с.
- Smirnov I.V., Ditenberg I.A., Grinyaev K.V., Radishevsky V.L. Features of formation of nanocrystalline state in internal-oxidized V-Cr-Zr-W and V-Mo-Zr system alloys during deformation by torsion under pressure // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016. V. 116. № 1. I. 012037. P. 1–5.
- Тюменцев А.Н., Дитенберг И.А., Коротаев А.Д., Денисов К.И. Эволюция кривизны кристаллической решетки в металлических материалах на мезо и наноструктурном уровнях пластической деформации // Физическая мезомеханика. – 2013. – Т. 16. – №. 3.

293